

題：

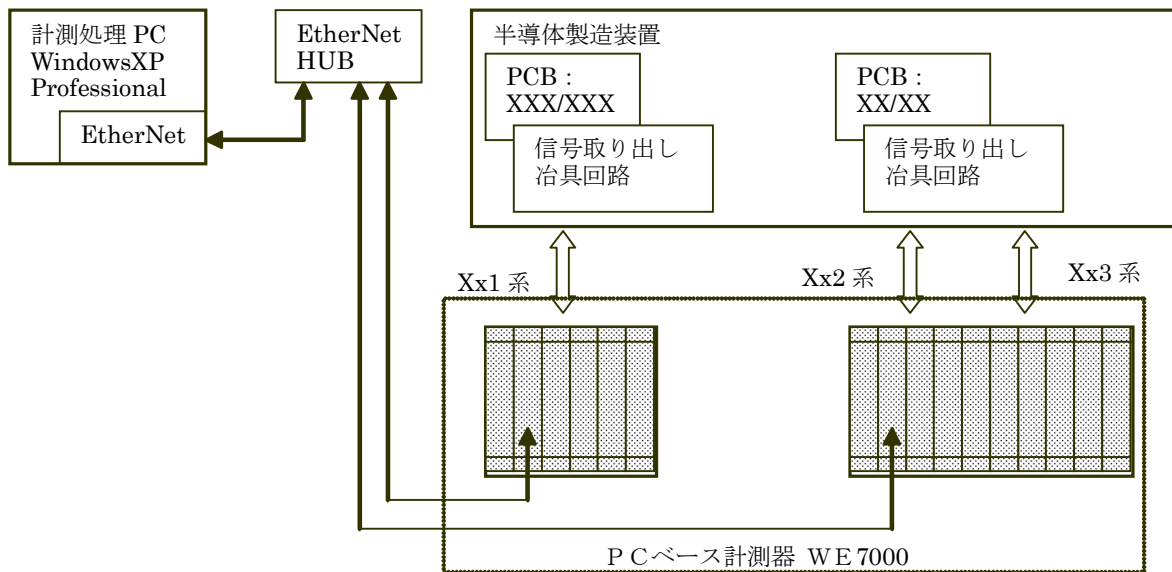
横河電機製、WE7000 計測システムを使用しての半導体製造装置の故障診断計測システム

1. 概略

- 半導体製造装置の必要な信号を取り出し常時監視を行い、目的の状態に一致した場合、前後の必要な時間の対象信号の計測を行いデータベース化して行く。

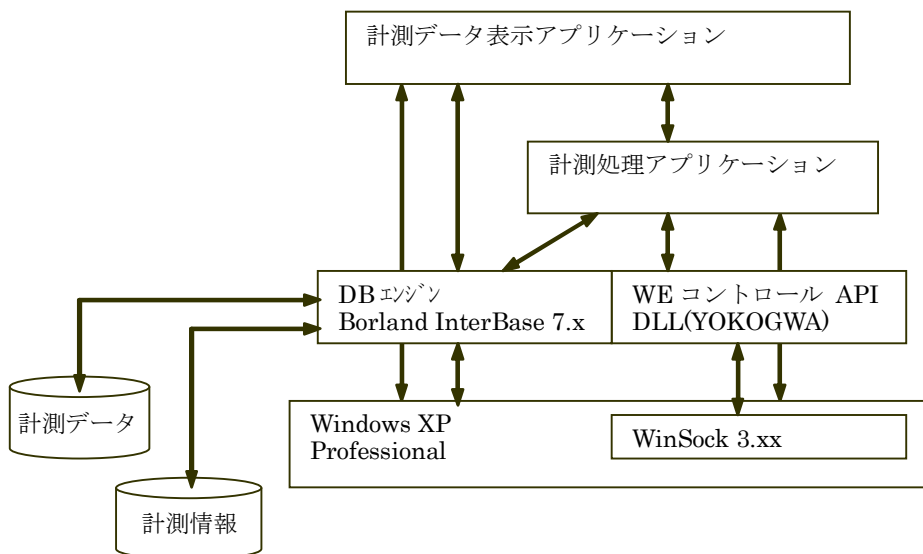
2. システム構成

2. 1. ハードウェア構成



2. 2. ソフトウェア構成

- 以下に計測処理PCのソフトウェア構成を示します。



3. 開発、作成内容

- 計測処理アプリケーション

GUIを持たず上位の呼び出しに対して WE7000 計測システムを制御して目的の計測を行うプログラム。

- 計測データ表示アプリケーション

規定されたスケジュールに従い、計測アプリケーションに対して対応する項目の計測を要求し、結果を順次 DB して行く。

また、過去の計測データを再現して表示する。

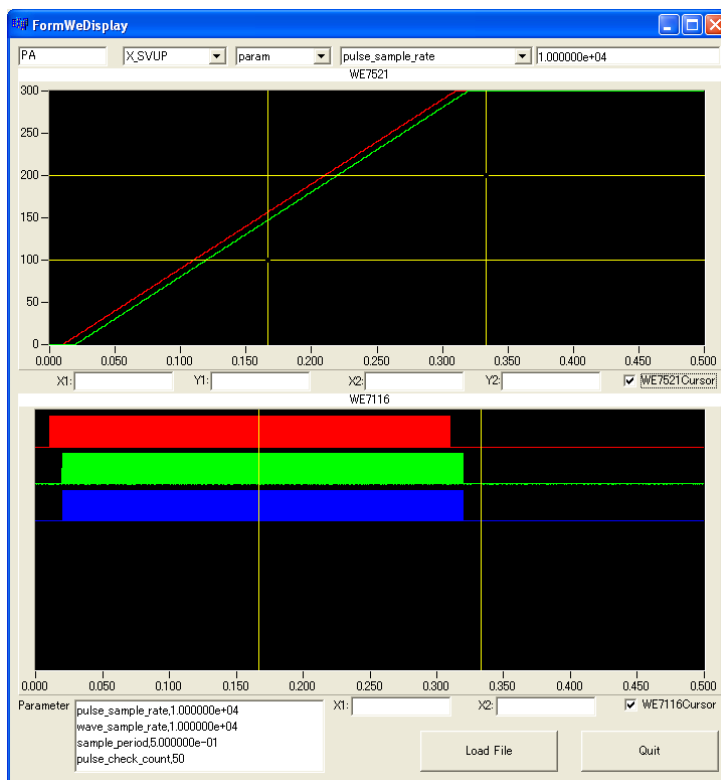
- 開発環境、ツール：

BC6++

Borland InterBase 7.xx

National Instruments Measurement Studio 6.xx

4. 画面例



—以上—